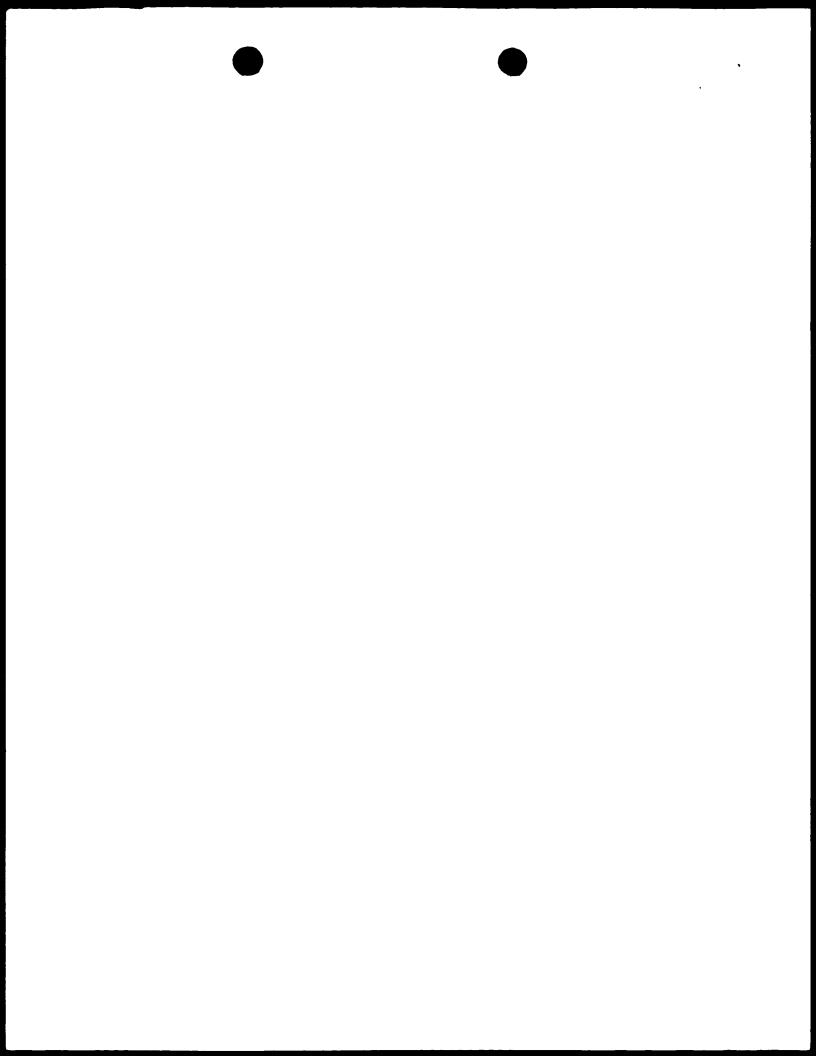
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

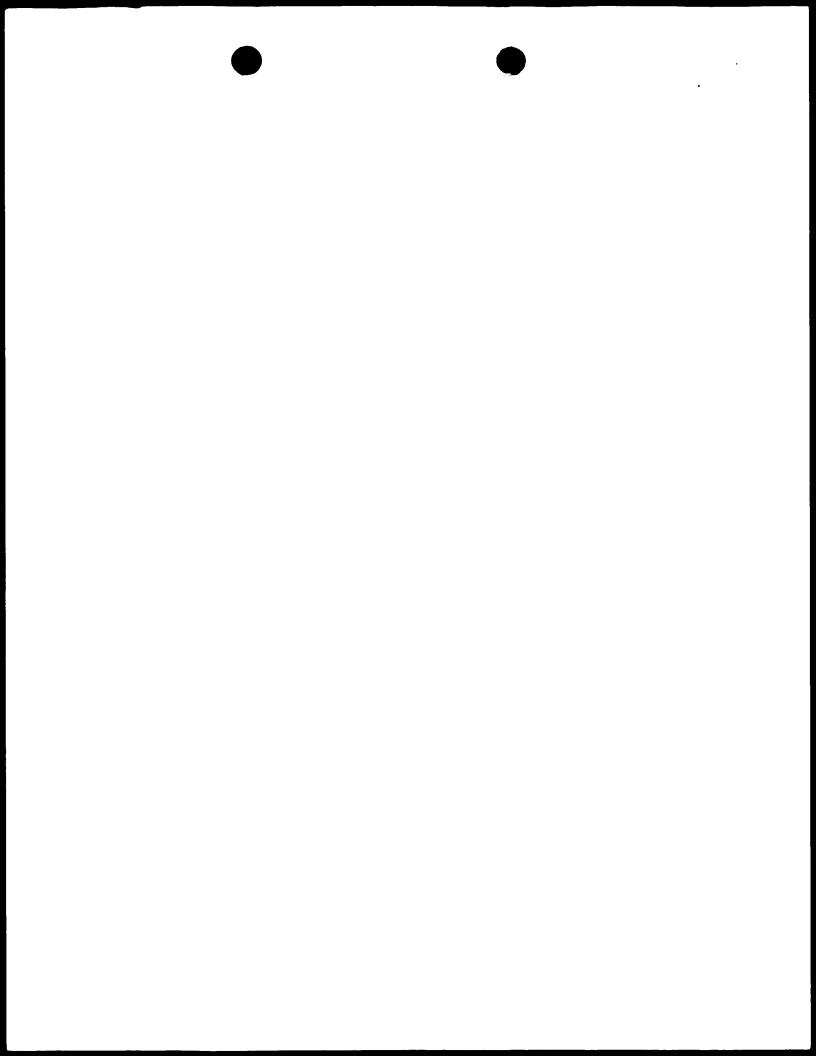
Référence du dossier du déposant ou	POUR SUITE	voir la notification de transr (formulaire PCT/ISA/220) e	mission du rapport de	recherche internationale
du mandataire B4677 PCT	A DONNER	(TOTTIUIAITE FO F/ISA/220) E	a, ie cas echeant, le :	point o or aproo
Demande internationale n°	Date du dépôt inter	national <i>(jour/mois/annee)</i>	(Date de priorité (la (jour/mois/année)	plus ancienne)
PCT/FR 01/01077	09/0	04/2001	,	04/2000
Déposant		-		
 DOLPHIN INTEGRATION et al				
Le présent rapport de recherche internation déposant conformément à l'article 18. Un	onale, établi par l'adn e copie en est transn	ninistration chargée de la re iise au Bureau internationa	echerche internationa I.	ile, est transmis au
Ce rapport de recherche internationale co	omprend2_	feuilles.		
		 e document relatif à l'état c	de la technique qui y	est cité.
Base du rapport				
a. En ce qui concerne la langue , la langue dans laquelle elle a été dé	recherche internatior posée, sauf indication	ale a été effectuée sur la b n contraire donnée sous le	ase de la demande i même point.	nternationale dans la
la recherche international	e a été effectuée sur	la base d'une traduction de	e la demande interna	tionale remise à l'administration.
b. En ce qui concerne les séquenc la recherche internationale a été é	es de nucléotides o effectuée sur la base	u d'acides aminés divulgu du listage des séquences	iées dans la demand :	e internationale (le cas échéant),
contenu dans la demande				
		s forme déchiffrable par ord	linateur.	
remis ultérieurement à l'a				
		orme déchiffrable par ordina		ont no vac nac au delà de la
divulgation faite dans la c	lemande telle que dé	posée, a été fournie.		ent ne vas pas au-delà de la
La déclaration, selon laque du listage des séquences	uelle les informations s présenté par écrit, a	enregistrées sous forme de été fournie.	échiffrable par ordina	teur sont identiques à celles
2. Il a été estimé que certa	nines revendications	ne pouvaient pas faire l'	objet d'une recherc	the (voir le cadre I).
3. Il y a absence d'unité d	e l'invention (voir le	cadre II).		
4. En ce qui concerne le titre ,				
le texte est approuvé tel d	qu'il a été remis par le	e déposant.		
Le texte a été établi par l'				
5. En ce qui concerne l'abrégé,				
le texte est approuvé tel	qu'il a été remis par l	e déposant		
le texte (reproduit dans le présenter des observatio	ns à l'administration	li par l'administration confo dans un délai d'un mois à c	rmément à la règle 3 compter de la date d'e	8.2b). Le déposant peut expédition du présent rapport
de recherche internationa 6. La figure des dessins à publier avec		e n°	2	
x suggérée par le déposan				Aucune des figures
parce que le déposant n'		ıre.		n'est à publier.
parce que cette figure ca	ractérise mieux l'inve	ntion.		
1				



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT 01/01077

			101,01077
A. CLASSEI CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE G11C7/14 G11C17/18		
Selon la clar	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifica	tion nationale et la C	CIB
	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
	nion minimale consultee (systeme de classification suivi des symboles de G11C	e classement)	
	tion consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou d		
	nnees electronique consultee au cours de la recherche internationale (no ternal, PAJ	om de la base de do	nnees, et si realisable, termes de recherche utilises)
C. DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication de	es passages pertine	no. des revendications visees
Х	US 4 669 065 A (OHSAWA AKIRA)		1-3,6,7
Y	26 mai 1987 (1987-05-26) colonne 6-8; figure 6		5
Y	US 6 018 481 A (SHIRATAKE SHINICHI 25 janvier 2000 (2000-01-25) abrégé; figure 5	RO)	5
А	DE 199 28 598 A (MITEL SEMICONDUCT 30 décembre 1999 (1999-12-30) abrégé; figure 3	OR LTD)	5
A	US 4 622 655 A (SUZUKI SHUNICHI) 11 novembre 1986 (1986-11-11) figures 4,6,8		1-8
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documer	nts de familles de brevets sont indiqués en annexe
A docume	ent définissant l'état general de la technique, non dère comme particulièrement pertinent	date de priorité e technique pertine	r publie après la date de depôt international ou la it n'appartenenant pas à l'état de la ent, mais cité pour comprendre le principe stituant la base de l'invention
ou apr	res cette date ent pouvant jeter un doute sur une revendication de	document particul être considérée d inventive par rap	ierement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut comme nouvelle ou comme impliquant une activité port au document considéré isolement
priorite autre		ne peut être cons lorsaue le docum	ierement pertinent; l'inven tion revendiquée sideree comme impliquant une activile inventive nent est associé à un ou plusieurs autres ième nature, cette combinaison étant évidente
P docume	ent public avant la date de dénôt international, mais	pour une personi document qui fait	ne du métier partie de la même famille de brevets
Date à laqu	uelle la recherche internationale a eté effectivement achevee	Date d'expédition	n du present rapport de recherche internationale
	29 juin 2001	05/07/	2001
Nom et adre	esse postale de l'administration chargee de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Fonctionnaire au	torise
	NL - 2260 FV DISWIN Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016	Czarik	, D



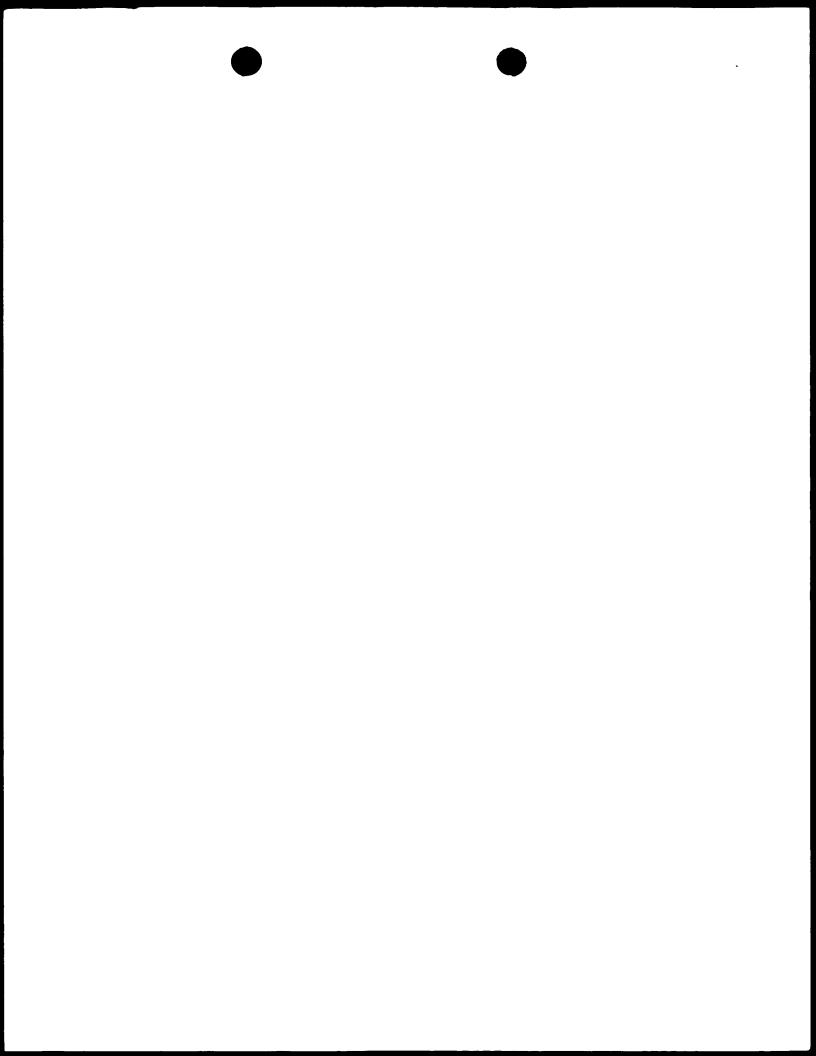
INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Informat

patent family members

PCT Application No

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
US 4669065	Α	26-05-1987	JP	60115095 A	21-06-1985
US 6018481	Α	25-01-2000	JP	11126498 A	11-05-1999
DE 19928598	Α	30-12-1999	GB FR US	2338808 A 2783081 A 6198678 B	29-12-1999 10-03-2000 06-03-2001
US 4622655	Α	11-11-1986	JP JP JP DE EP	1811784 C 4080479 B 59203298 A 3480242 D 0124868 A	27-12-1993 18-12-1992 17-11-1984 23-11-1989 14-11-1984



(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 18 octobre 2001 (18.10.2001)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 01/78078 A1

PHIN INTEGRATION [FR/FR]; 39. avenue du Granier,

Hervé [FR/FR]; 19, avenue de Verdun, F-38240 Meylan (FR). COMPAGNE, Eric [FR/FR]; 44, Impasse du Bois

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : DOL-

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): COVAREL,

(74) Mandataire: MICHEL DE BEAUMONT; Cabinet Con-

seil, 1, rue Champollion, F-38000 Grenoble (FR).

- (51) Classification internationale des brevets? : G11C 7/14. 17/18
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR01/01077

- (22) Date de dépôt international: 9 avril 2001 (09.04.2001)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

00/04589

10 avril 2000 (10.04.2000)

FR

(81) États désignés (national) : JP, US.

Radier, F-38920 Crolles (FR).

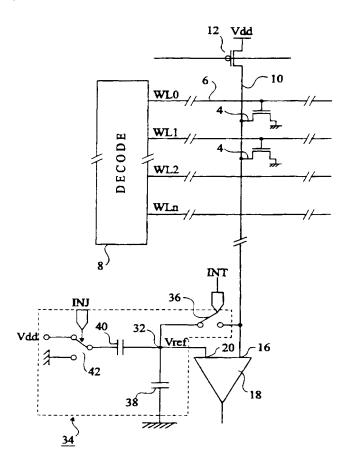
F-38240 Meylan (FR).

(72) Inventeurs; et

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DEVICE FOR READING A STORAGE

(54) Titre: DISPOSITIF DE LECTURE D'UNE MEMOIRE



- (57) Abstract: The invention concerns a device for reading a storage cell (4), comprising a reading differential amplifier (18) having a first input terminal (16) connected to a column of cells (10) and a circuit (34) designed to feed to a second input terminal (20) of the amplifier (18) a reference voltage (Vref). The circuit (34) comprises means (38) for storing the voltage of said column and means (38, 40, 42) for applying as reference voltage (Vref) the stored voltage modified by a predetermined quantity.
- (57) Abrégé: L'invention concerne un dispositif de lecture d'une cellule (4) d'une mémoire, comprenant un amplificateur différentiel de lecture (18) ayant une première borne d'entrée (16) reliée à une colonne de cellules (10) et un circuit (34) destiné à fournir à une deuxième borne d'entrée (20) de l'amplificateur (18) une tension de référence (Vref). Le circuit (34) comporte un moyen (38) pour mémoriser la tension de ladite colonne et un moyen (38, 40, 42) pour appliquer en tant que tension de référence (Vref) la tension mémorisée modifiée d'une quantité prédéterminée.



WO 01/78078 A1



(84) États désignés *(régional)*: brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

Publiée:

avec rapport de recherche internationale

15

20

DISPOSITIF DE LECTURE D'UNE MÉMOIRE

La présente invention concerne un dispositif de lecture d'une mémoire et plus particulièrement d'une mémoire morte (ROM, PROM, EPROM, EEPROM).

La figure l représente schématiquement et partiellement une mémoire ROM 2 comportant une pluralité de points mémoire disposés en rangées ou lignes de mot et en colonnes ou lignes de bit. Chaque point mémoire comporte ou non une cellule active 4. Les cellules 4 sont constituées de transistors ou tout autre circuit de commutation susceptible de connecter vers une tension basse, couramment la masse, la colonne comportant cette cellule. L'adressage des cellules 4 est réalisé par des rangées ou lignes de mot WL 6 reliées à un décodeur de ligne 8. Quand une cellule active est adressée, elle modifie le potentiel de la colonne 10 à laquelle elle est connectée. Dans le cas d'une simple ROM, certaines cellules sont rendues non actives par construction, généralement par suppression de l'une de leurs connexions, et le point mémoire correspondant ne relie jamais la colonne correspondante à la masse quel que soit le potentiel de rangée correspondant. Chaque colonne 10 est reliée à un potentiel d'alimentation haut Vdd par l'intermédiaire d'un transistor de précharge 12 et est reliée à une première entrée 16 d'un amplificateur de lecture 18. Des groupes de colonnes sont éventuellement associés par des

15

20

25

30

35

multiplexeurs (non représentés). Une deuxième entrée 20 de chaque amplificateur de lecture 18 est reliée à un potentiel de référence Vref.

Pour lire un point mémoire, la colonne 10 est portée à un potentiel de précharge Vpch qui est sensiblement égal à la tension d'alimentation Vdd et un signal haut est appliqué sur l'une des rangées WL. Si le point mémoire n'est pas programmé, la colonne 10 conserve sensiblement la tension de précharge sur sa borne 16. Par contre, si le point mémoire est programmé, la colonne 10 est déchargée par un courant I qui passe dans la cellule 4. La tension sur la ligne 10 chute et l'amplificateur de lecture 18 commute lorsque la tension sur la borne 16 passe en dessous du potentiel de référence Vref sur la borne 20. Le temps de commutation de l'amplificateur 18 ou temps de lecture est donné par la relation :

$T = C.\Delta V/I$

dans laquelle ΔV est la différence de potentiel Vpch-Vref entre les entrées 16 et 20 de l'amplificateur de lecture 18, au-delà de laquelle se produit la commutation de l'amplificateur de lecture 18, C représente la capacité de la colonne 10 et I représente la valeur du courant qui passe dans la cellule 4.

Les valeurs respectives de la capacité C et du courant I peuvent être considérées comme constantes. Ainsi, pour réduire le temps de lecture T, il faut réduire la tension ΔV , c'est-à-dire choisir une tension Vref aussi proche que possible de Vpch. Or, il est nécessaire de prévoir une marge de sécurité pour tenir compte des dérives technologiques, des décalages de potentiels aux entrées de l'amplificateur 18, des fluctuations des potentiels V0 et V1 vref, du potentiel bas V2 et de la différence entre V2 vpch.

Une solution connue pour optimiser la valeur de Vref consiste à effectuer une lecture différentielle en ajoutant à la mémoire 2 des colonnes témoin et en prélevant une tension de référence sur ces colonnes témoin. En pratique, il faut prévoir un assez grand nombre de colonnes témoin, par exemple une pour huit

10

15

20

25

30

35

colonnes réelles. Cette solution présente donc l'inconvénient d'accroître la taille et le coût de la mémoire. En outre, chaque colonne témoin 21 introduit une capacité parasite.

Un objet de la présente invention est de prévoir un procédé et un dispositif de lecture d'une mémoire ROM palliant les inconvénients ci-dessus.

Cet objet est atteint grâce à un dispositif de lecture d'une cellule d'une mémoire, comprenant un amplificateur différentiel de lecture ayant une première borne d'entrée reliée à une colonne de cellules et un circuit destiné à fournir à une deuxième borne d'entrée de l'amplificateur une tension de référence. Le circuit susmentionné comporte un moyen pour mémoriser la tension de ladite colonne et un moyen pour appliquer en tant que tension de référence la tension mémorisée modifiée d'une quantité prédéterminée.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, la présence d'une cellule se manifeste par une réduction du potentiel d'une colonne et la tension de référence est réduite d'une quantité prédéterminée par rapport à la tension mémorisée.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, le circuit susmentionné comporte un premier élément capacitif destiné à mémoriser la tension de précharge et un deuxième élément capacitif connectable en parallèle sur le premier pour fixer la valeur de la tension de référence.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, les éléments capacitifs sont constitués des capacités grillesource, grille-substrat et grille-drain de transistors MOS.

La présente invention vise aussi un procédé de lecture d'une cellule d'une mémoire, comprenant les étapes consistant à mémoriser la tension d'une colonne juste avant une lecture ; et modifier la tension mémorisée d'une quantité prédéterminée et utiliser la tension modifiée comme tension de référence.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, ce procédé de lecture consiste en outre à comparer la tension de référence à une tension de colonne.

Selon un mode de réalisation de la présente invention, ce procédé de lecture consiste en outre à appliquer la tension de précharge sur un premier condensateur ; déconnecter le premier condensateur de la tension de précharge ; et connecter en parallèle sur le premier condensateur un deuxième condensateur.

Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1, décrite précédemment, représente schématiquement et partiellement une mémoire ROM selon l'art antérieur;

10

15

20

25

30

35

la figure 2 représente schématiquement une colonne d'une mémoire ROM reliée à un dispositif de lecture selon l'invention ; et

la figure 3 est un chronogramme illustrant le procédé de lecture d'une mémoire de type ROM selon l'invention.

La figure 2 illustre une seule colonne ou ligne de bit 10 d'une mémoire ROM reliée à un dispositif de lecture selon l'invention. Cette colonne 10 est associée à plusieurs cellules 4 et est reliée à un potentiel d'alimentation haut Vdd par l'intermédiaire d'un transistor de précharge 12. L'état d'une cellule 4 (programmé ou non programmé) est lu lorsque la rangée 6 correspondant à cette cellule est sélectionnée par le décodeur de ligne 8. Une borne de la colonne 10 est reliée à une première entrée 16 d'un amplificateur différentiel 18. Une deuxième entrée 20 de l'amplificateur 18 est reliée à un nœud 32 d'un circuit 34 destiné à fournir une tension de référence Vref. Le nœud 32 est relié à la colonne 10 par l'intermédiaire d'un interrupteur 36 commandé par un signal binaire INT. Le nœud 32 est relié à la masse par un premier élément capacitif 38. Le nœud 32 est relié à la première borne d'un deuxième élément capacitif 40 dont la deuxième borne peut être connectée à une première tension V1 ou à la masse par un interrupteur 42 commandé par un signal binaire INJ.

30

35

La figure 3 illustre le fonctionnement du dispositif de lecture selon l'invention. La courbe 50 représente le signal INT, la courbe 52 représente le signal INJ, la courbe 54 représente le signal de la ligne de mot WL, la courbe 56 représente la tension d'un point mémoire non programmé (absence de cellule active), la courbe 57 représente la tension d'un point mémoire programmé (présence d'une cellule active), et la courbe 58 représente la tension de référence Vref générée par le circuit 34 à l'entrée 20 de l'amplificateur 18.

Initialement, la colonne 10 est connectée au moyen du transistor de précharge 12 à la tension d'alimentation Vdd et prend une tension Vpch proche de la tension Vdd, qui dépend de la structure de la mémoire.

A un instant t1 auquel on souhaite effectuer une lecture, on fait passer le signal INT de l'état logique "1" à l'état logique "0" pour ouvrir l'interrupteur 36 qui était initialement fermé. Le nœud 32 reste alors au potentiel de la ligne 10.

A un instant t2, on fait passer le signal binaire INJ de l'état logique "0" à l'état logique "1". Ceci a pour effet de faire commuter le commutateur 42 et de connecter la deuxième borne de l'élément capacitif 40 à la masse (Vss). Les deux éléments capacitifs se retrouvent alors en parallèle et la répartition de la charge stockée sur les éléments capacitifs 38 et 40 est modifiée. Si on appelle C1, C2 les valeurs des capacités des éléments capacitifs 38, 40 et que l'on considère pour simplifier que Vss est égal à 0 :

- la charge Q1 initialement stockée sur l'élément capacitif 38 est égale à C1.Vpch, la charge Q2 initialement stockée sur l'élément capacitif 40 est égale à C2(Vpch-V1); la charge totale est donc Q = (C1+C2)Vpch - C2.V1
- après la fermeture de l'interrupteur 42, la charge sur les condensateurs 38 et 40 et Q devient égale à (C1+C2)Vref.

Ainsi Vref = Vpch - V1.C2/(C1+C2)

On pourra par exemple choisir V1 = Vdd ou V1 = Vpch

20

25

30

et la tension de référence sera une tension réduite par rapport à Vpch, par exemple liée à Vpch par un coefficient constant égal à C1/(C1+C2). La tension de référence est donc définie de façon très précise par rapport à la tension de précharge sur la ligne 10. On peut donc choisir une tension de référence très proche de la tension de précharge. On notera que d'autres circuits soustracteurs ou diviseurs pourront être prévus par l'homme de l'art pour fournir une tension de référence liée à une tension de précharge mémorisée.

A un instant t3, on fait passer le signal binaire de lecture WL de l'état logique "0" à l'état logique "1". Si le point mémoire considéré n'est pas programmé, le potentiel de la ligne 10 au point 16 reste à son niveau initial de précharge, illustré par la courbe 56 ou chute très lentement par rapport à ce niveau. Si le point mémoire considéré est programmé, la colonne 10 se décharge. A un instant t4, le potentiel de la ligne 10, illustré par la courbe 57, devient inférieur à Vref et la lecture est effectuée. Du fait que Vref est peu inférieur à Vpch, la durée t3-t4 est particulièrement brève.

Dans un mode de réalisation, les premier et deuxième éléments capacitifs 38, 40 peuvent être des capacités de transistors NMOS, par exemple des capacités grille-substrat de transistors dont le drain, la source et le substrat sont reliés à la masse.

L'homme de l'art pourra apporter diverses variantes à l'invention du moment qu'il prévoit de mémoriser la tension d'une colonne de mémoire ROM juste avant une lecture et d'utiliser une fraction de cette tension comme tension de référence de lecture. De plus bien que l'invention ait été décrite en relation avec une mémoire pour laquelle le potentiel d'une colonne est susceptible de diminuer, elle s'appliquera également au cas d'une mémoire dont le potentiel d'une colonne est susceptible d'augmenter. Le potentiel de référence sera alors augmenté par rapport au potentiel normal d'une colonne.

A titre de variante, on notera que les synchronisations mutuelles des signaux WL, INT et INJ pourront être modifiées. De préférence INJ sera retardé par rapport à INT par un inverseur. WL pourra être commuté après, en même temps, ou peu avant INT.

Bien que l'invention ait été décrite dans le cadre de mémoires mortes, on notera qu'elle s'applique de façon générale à toute mémoire dans laquelle chaque cellule est associée à une seule colonne de lecture.

Dans le mode de réalisation décrit, les colonnes sont associées à des transistors de précharge 12 à commande commune. On pourrait prévoir des commandes séparées pour chaque transistor de précharge ou pour des sous-ensembles de transistors de précharge. Ceci permet de réduire la consommation à chaque lecture.

15

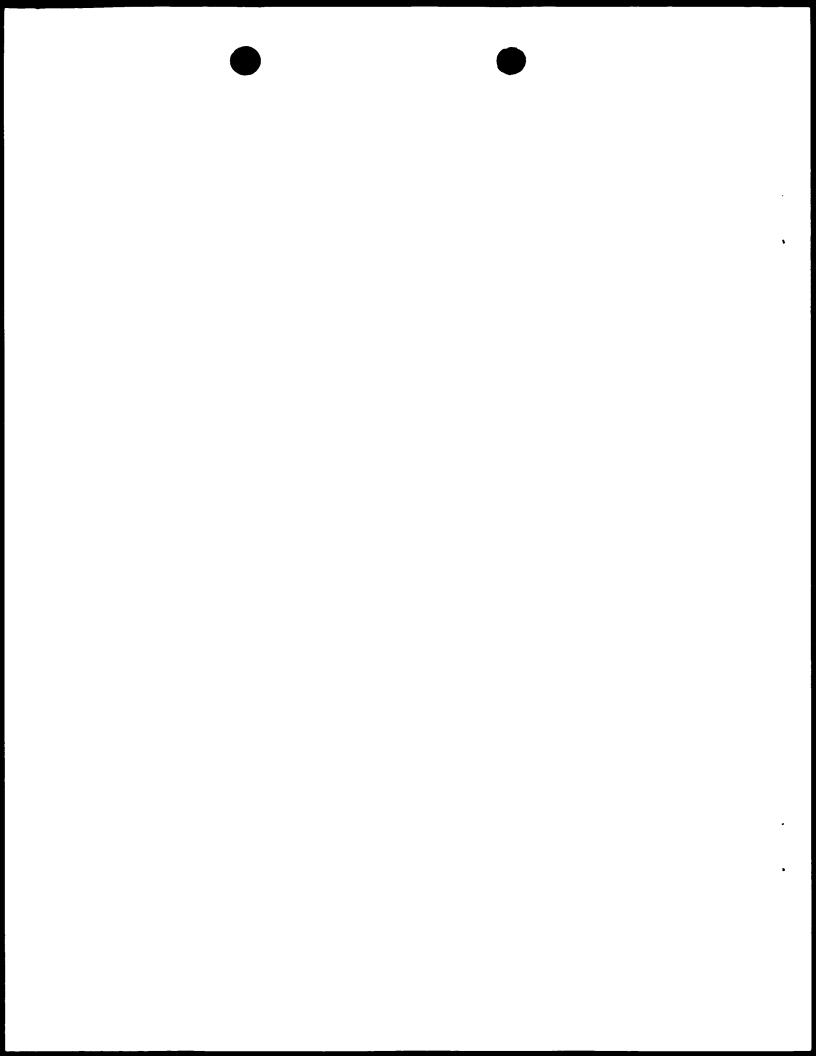
20

30

REVENDICATIONS

- 1. Dispositif de lecture d'une cellule (4) d'une mémoire, comprenant un amplificateur différentiel de lecture (18) ayant une première borne d'entrée (16) reliée à une colonne de cellules (10) et un circuit (34) destiné à fournir à une deuxième borne d'entrée (20) de l'amplificateur (18) une tension de référence (Vref), caractérisé en ce que ledit circuit (34) comporte un moyen (38) pour mémoriser la tension de ladite colonne et un moyen (38, 40, 42) pour appliquer en tant que tension de référence (Vref) la tension mémorisée modifiée d'une quantité prédéterminée.
- 2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la présence d'une cellule se manifeste par une réduction du potentiel d'une colonne et caractérisé en ce que la tension de référence est réduite d'une quantité prédéterminée par rapport à la tension mémorisée.
- 3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit circuit (34) comporte un premier élément capacitif (38) destiné à mémoriser la tension de précharge (Vpch) et un deuxième élément capacitif (40) connectable en parallèle sur le premier pour fixer la valeur de la tension de référence (Vref).
- 4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que les éléments capacitifs sont constitués des capacités grille-source, grille-substrat et grille-drain de transistors MOS.
- 5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque colonne est associée à un transistor de précharge (12) et en ce que les transistors de précharge sont adressables indépendamment.
 - 6. Procédé de lecture d'une cellule (4) d'une mémoire, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
 - mémoriser la tension d'une colonne juste avant une lecture ; et

- modifier la tension mémorisée d'une quantité prédéterminée et utiliser la tension modifiée comme tension de référence.
- 7. Procédé de lecture selon la revendication 6, carac-5 térisé en ce qu'il consiste en outre à comparer ladite tension de référence à une tension de colonne.
 - 8. Procédé de lecture selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :
- appliquer la tension de précharge (Vpch) sur un 10 premier condensateur (38) ;
 - déconnecter le premier condensateur de la tension de précharge ; et
 - connecter en parallèle sur le premier condensateur un deuxième condensateur (40).



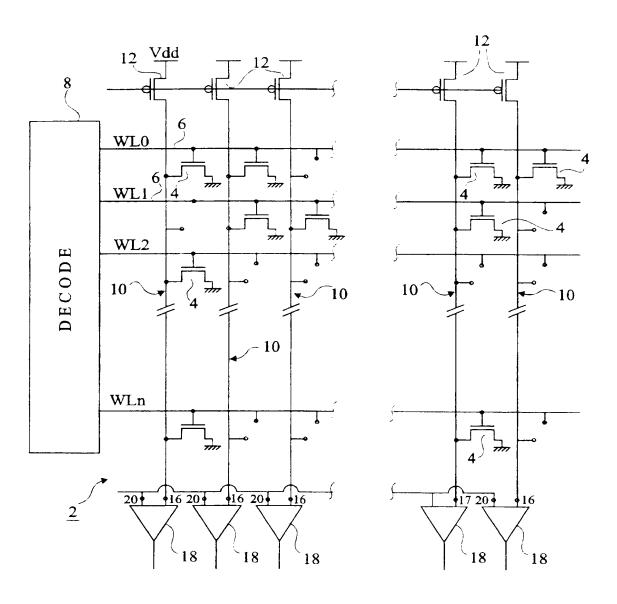
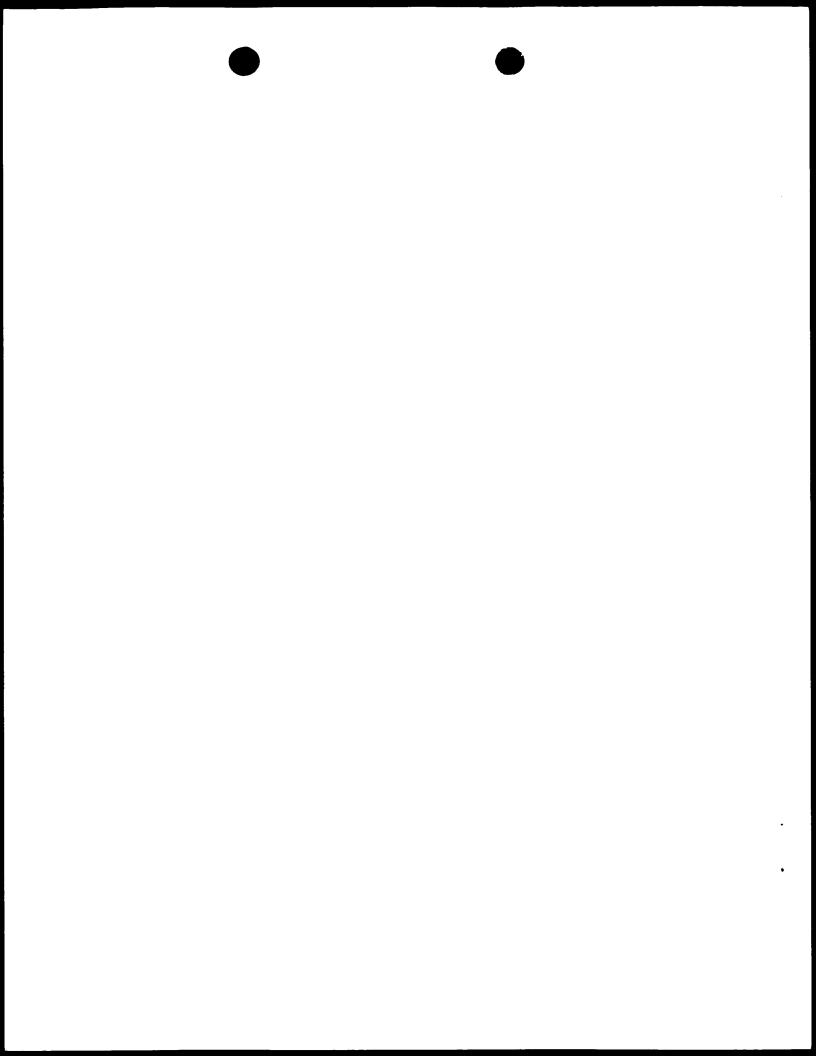


Fig 1



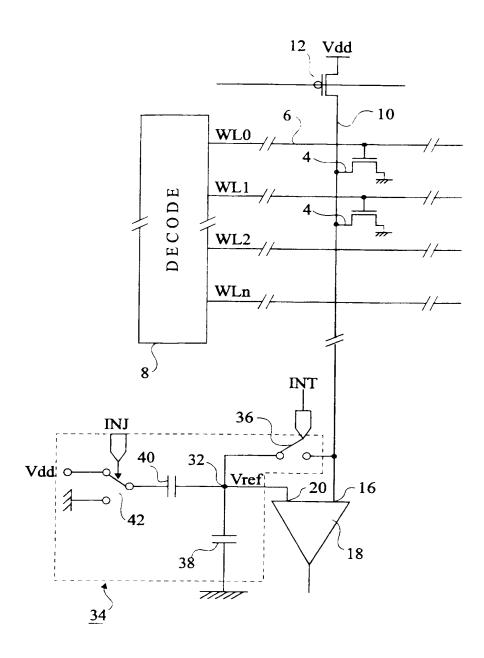
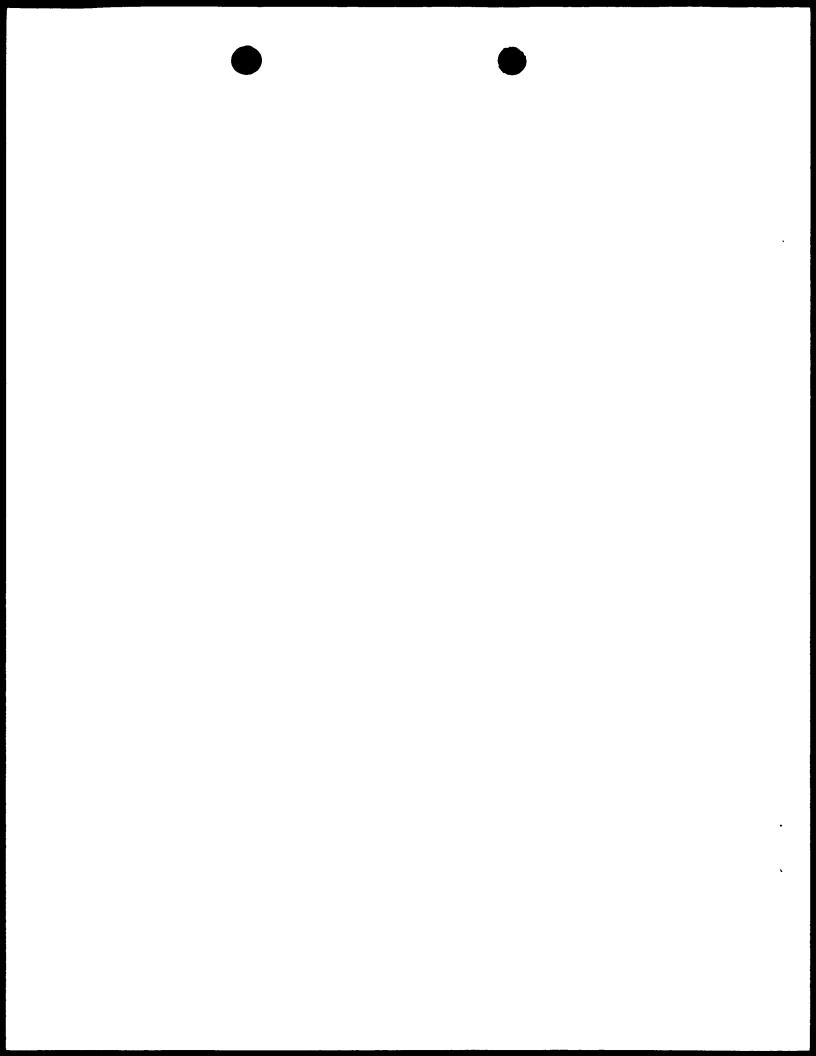


Fig 2



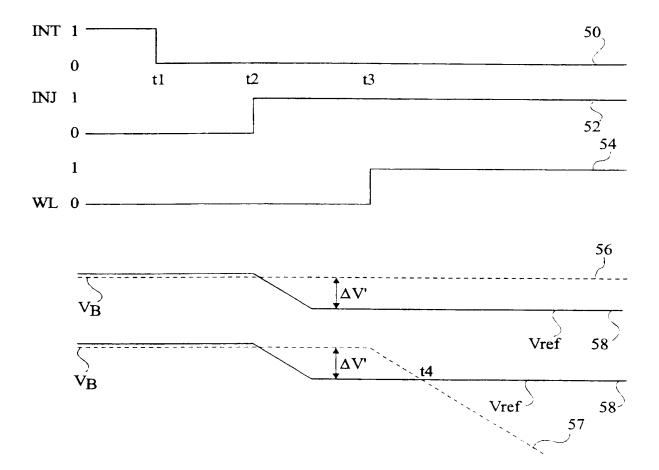
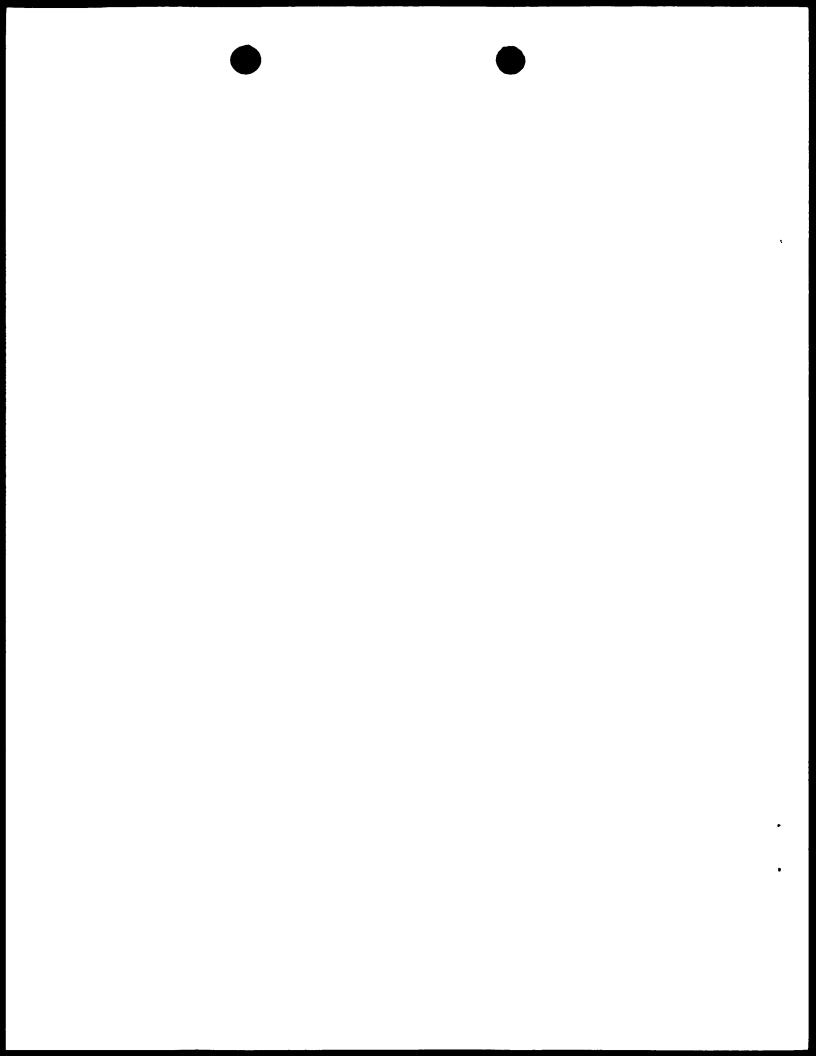


Fig 3



IPC 7	G11C7/14 G11C17/18		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national cla	assification and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum d IPC 7	locumentation searched (classification system followed by class $G11C$	sification symbols:	
	alion searched other than minimum documentation to the extent		
	data base consulted during the international search (name of dance)	ata base and, where practical, search terms used	1)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of t	he relevant passages	Relevant to claim No
х	US 4 669 065 A (OHSAWA AKIRA) 26 May 1987 (1987-05-26)		1-3.6.7
Y	column 6-8; figure 6		5
Y	US 6 018 481 A (SHIRATAKE SHIM 25 January 2000 (2000-01-25) abstract; figure 5	NICHIRO)	5
А	DE 199 28 598 A (MITEL SEMICON 30 December 1999 (1999-12-30) abstract; figure 3	NDUCTOR LTD)	5
A	US 4 622 655 A (SUZUKI SHUNICH 11 November 1986 (1986-11-11) figures 4.6.8	4I)	1-8
Furl	ther documents are listed in the continuation of box C	Patent tamily members are listed	in annex
° Special ca	ategories of cited documents	"T" later document published after the inte	rnational filing date
consi	ent defining the general state of the lart which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but eory underlying the
which citatio	ent which may throw doubts on priority claim(s) or its cried to establish the publication date of another in or other special reason (as specified)	 "X" document of particular relevance, the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cannot be considered to involve an involve a	be considered to cument is taken alone taimed invention ventive step when the
other	ent reterring to an oral disclosure, use, exhibition or means lent published prior to the international filling date but han the priority date claimed	document is combined with one or mo ments such combination being obvior in the art *8* document member of the same patent	is to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2	29 June 2001	05/07/2001	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL = 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo ni Fax (+31-70) 340-3016	Czarik, D	

INTENTIONAL SEARCH REPORT

interna al Application No PCT/FR 01/01077

Patent document cited in search report		; Publication date		Patent family member:s-	Publication date
US 4669065	А	26-05-1987	JP	60115095 A	21-06-1985
US 6018481	Α	25-01-2000	JP	11126498 A	11-05-1999
DE 19928598	A	30-12-1999	GB FR US	2338808 A 2783081 A 6198678 B	29-12-1999 10-03-2000 06-03-2001
US 4622655	A	11-11-1986	JP JP JP DE EP	1811784 C 4080479 B 59203298 A 3480242 D 0124868 A	27-12-1993 18-12-1992 17-11-1984 23-11-1989 14-11-1984

RAPPORT DE RECHE ENTERNATIONALE

Demar Stionale No

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 G11C7/14 G11C17 G11C17/18 Seion la classification internationale des brevets (CIB) ou a la fois seton la classification nationale et la CIB B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultee (système de classification suivi des symboles de classement CIB 7 G110 Documentation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevent des domaines sur lesquels à porte la recherche Base de données electronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si realisable, termes de recherche utilises) EPO-Internal, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS Identification des documents cries, avec, le cas echeant, l'indication des passages pertinents Categorie ° no, des revendications visees US 4 669 065 A (OHSAWA AKIRA) χ 1-3.6.726 mai 1987 (1987-05-26) colonne 6-8; figure 6 US 6 018 481 A (SHIRATAKE SHINICHIRO) 5 25 janvier 2000 (2000-01-25) abrégé; figure 5 DE 199 28 598 A (MITEL SEMICONDUCTOR LTD) 5 Α 30 décembre 1999 (1999-12-30) abrégé; figure 3 US 4 622 655 A (SUZUKI SHUNICHI) Α 1-8 11 novembre 1986 (1986-11-11) figures 4,6,8 Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents X. Les documents de familles de brevets sont indiques en annexe · Categories speciales de documents cites *I* document ulterieur publie après la date de depôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la *A* document definissant l'état general de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe considere comme particulierement perlinent ou la theorie constituant la base de l'invention document anteneur, mais publie a la date de depôt international "X" document particulierement pertinent. l'inven tion revendiquee ne peut ou apres cette date ètre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une activite document pouvant jeter un doute sur une revendication de pnonte ou cite pour determiner la date de publication d'une inventive par rapport au document considere isolement "Y" document particulierement pertinent. I'inven tion revendiquee autre citation ou pour une raison speciale (telle qui indiquee) ne peut être consideree comme impliquant une activite inventive lorsque le document est associe a un ou piusieurs autres *O* document se referant a une divulgation orale, a un usage, a une exposition ou tous autres movens documents de même nature, cette combinaison etant evidente pour une personne du metier document publie avant la date de depôt international, mais posterieurement a la date de priorite revendiquee *&* document qui fait partie de la même famille de brevets Date a laquelle la recherche internationale a ete effectivement achevee Date d'expedition du present rapport de recherche internationale 29 juin 2001 05/07/2001 Nom el adresse postale de l'administration chargee de la recherche internationale Fonctionnaire autorise Office Europeen des Brevets PB 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Ruswijk Tel (+31-70) 340-2040. Tx 31 651 epo ni

Czarik, D

Fax (+31-70) 340-3016

RAPPORT DE PECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relati

membres de familles de brevets

PCT/FR 01/01077

Document prevet cité au rapport de recherch		Date de publication	Membre(s) de la tamille de brevet(s)		Date de publication
US 4669065	A	26-05-1987	JP	60115095 A	21-06-1985
US 6018481	Α	25-01-2000	JP	11126 4 98 A	11-05-1999
DE 19928598	А	30-12-1999	GB FR US	2338808 A 2783081 A 6198678 B	29-12-1999 10-03-2000 06-03-2001
US 4622655	Α	11-11-1986	JP JP JP DE EP	1811784 C 4080479 B 59203298 A 3480242 D 0124868 A	27-12-1993 18-12-1992 17-11-1984 23-11-1989 14-11-1984